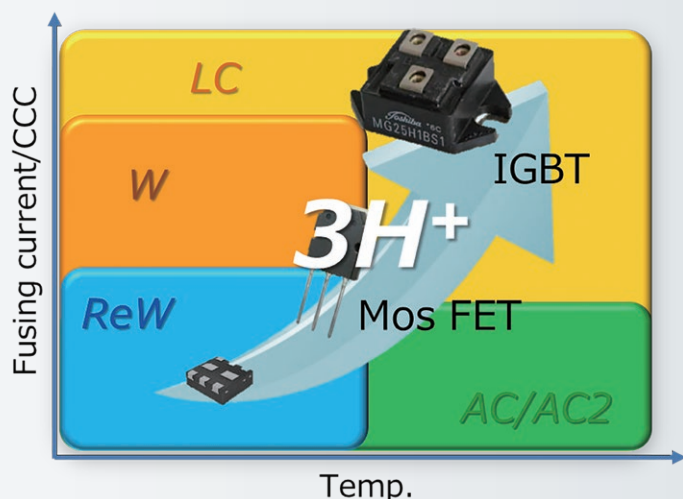


3H⁺ Probe

高温/高電流対応プローブ

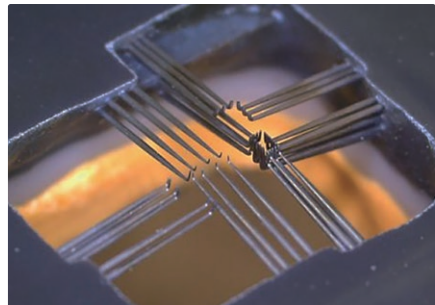
High Temperature / High Current Probe



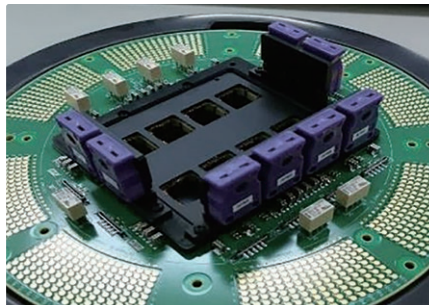
● 3H⁺対応マップ 3H⁺ compatible map

- 高温/高電流/高密度対応プローブ
High temperature/High current/High density probe
- 高温でも安定した接触性!!
Stable contact characteristics even at high temperatures
- 許容電流値はReWの1.5倍!!
Allowable current value is 1.5 times of ReW
- カンチレバー + B2 / B3 にも対応
Cantilever + also suitable for B2 / B3

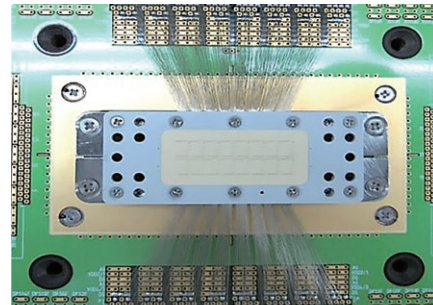
■ 対応構造 | Corresponding structure



IGBT/SiC向けカンチレバー
Cantilever for IGBT/SiC



TCプローブとの混載可能
Mixed loading with TC probe possible



垂直型B3
Vertical type B3

カード仕様 (カンチレバータイプ) | Card Specifications (Cantilever type)

先端面径 Tip Diameter	≥ φ19um
先端形状 Tip Shape	フラット Flat
針位置 Alignment	±5um
高さバラツキ Planarity	10um
針圧 Probe Force	1.8gf@OD60um
最小ピッチ Min Pitch	50um
温度 Temperature	-40 ~ 200℃